

R-700シリーズ

AC/DC MULTI TESTER



● PCはオプションです。

超高絶縁
Ultra-high insulation

最大検査ポイント 512ピン
Maximum inspection points
512 pins

高速・高精度
High speed / high accuracy

微小容量検査高分解能
Micro-Capacity Inspection
High resolution

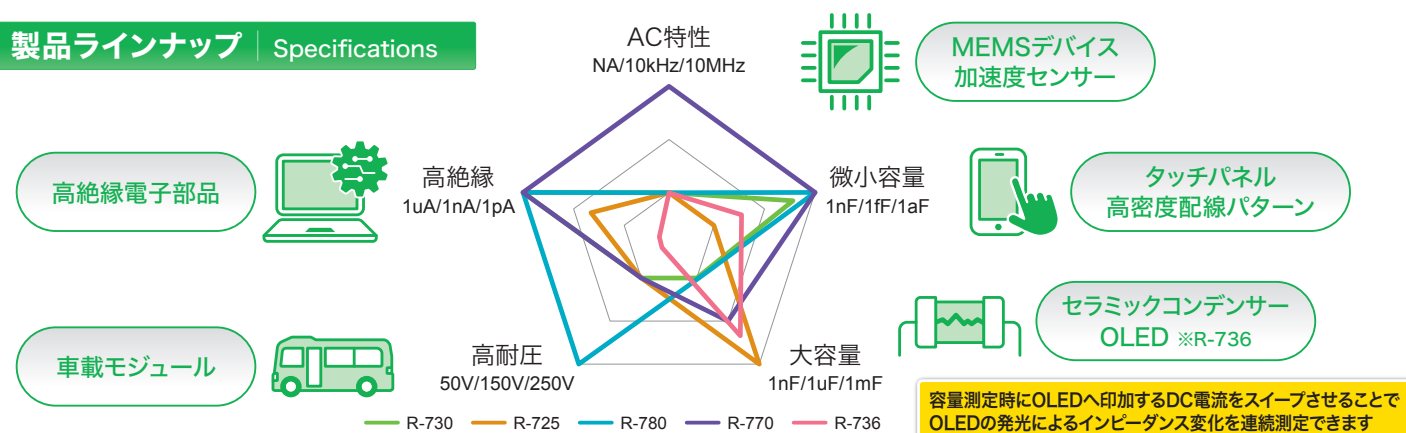
コンパクト設計
Compact Designs

4W低抵抗測定 0.1mΩ～
4W low resistance
measurement 0.1mΩ～

**薄膜RFフィルタ/車載DCモジュール/加速度センサ/MEMSデバイスなど
あらゆる製品を検査可能！**

Thin-film RF filters/Vehicle DC modules/Accelerometers/MEMS devices, Any products can be inspected!

製品ラインナップ Specifications



Item		R-730 Standard	R-725 Low Impedance	R-780 High Insulation	R-770 AC Dynamic	R-736 Sweep Test
Resistance		20V/0.2mA~20mA 1mΩ~10MΩ	24V/0.2mA~40mA 0.1mΩ~10MΩ	24V/0.2mA~40mA 0.1mΩ~10MΩ	24V/0.2mA~40mA 0.1mΩ~10MΩ	±10V/±40mA(OP)
Leakage		10V~50V/1mA~20mA 1MΩ~1GΩ	10V~50V/1mA~20mA 1MΩ~1GΩ	0.1V~250V/1mA~20mA 1MΩ~10TΩ	0.1V~50V/1mA~20mA 1MΩ~10TΩ	±10V/±40mA(OP)
Capacitance	Voltage	2V~15Vrms	5mV~15Vrms	5mV~15Vrms	5mV~15Vrms	100mV~5Vrms
	Frequency	10kHz~1MHz	100Hz~1MHz	1kHz~1MHz	1kHz~1MHz	1kHz
	Range	0.01pF~2000pF	1nF~10mF	0.01pF~2000pF	0.01pF~2000pF	10nF~10uF
	Min. Resolution	0.01fF	0.1pF	0.001fF	0.001fF	1pF
	Sweep Mode	NA	NA	NA	NA	AC_current, DC_current
AWG	Bandwidth	NA	NA	NA	DC~20MHz	NA
	Max.UpdateRate				50MS/s	
	Resolution				16bit	
Digitizer	Max.SampleRate	NA	NA	NA	15MS/s	NA
	Resolution				18bit	

外観及び仕様は予告なく変更になる場合があります。